

SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2420 z dnia 12 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 340 z dnia 24 grudnia 2015 r.)

Strona 58, pozycja 1C007:

- zamiast:* „Następujące proszki ceramiczne, „niekompozytowe” materiały ceramiczne, „materiały kompozytowe” na „matrycy” ceramicznej oraz materiały macierzyste;”
- powinno być:* „Następujące proszki ceramiczne, „niekompozytowe” materiały ceramiczne, materiały „kompozytowe” na „matrycy” ceramicznej oraz materiały macierzyste.”

Strona 88, pozycja 1C450.b.5:

- zamiast:* „N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoetan-2-ole i odpowiednie protonowane sole, inne niż N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetanol (96-80-0) i N,N-dietyloaminoetanol (100-37-8) wyszczególnione w pozycji 1C350;”
- powinno być:* „N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoetan-2-ole i odpowiednie protonowane sole, inne niż N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetanol (96-80-0) i N,N-dietyloaminoetanol (100-37-8) wyszczególnione w pozycji 1C350;”

Strona 105, pozycja 2B201 otrzymuje brzmienie:

„2B201 Obrabiarki i wszelkie ich zestawy poza wyszczególnionymi poniżej w pozycji 2B001, do skrawania lub cięcia metali, materiałów ceramicznych lub „kompozytowych”, które stosownie do specyfikacji technicznej producenta mogą być wyposażone w urządzenia elektroniczne do jednoczesnego „sterowania kształtowego” w dwóch lub więcej osiach:

Uwaga techniczna:

Zamiast indywidualnych testów dla każdego modelu obrabiarki można stosować poziomy ‘gwarantowanej dokładności pozycjonowania’, ustalone zgodnie z poniższymi procedurami przy pomiarach wykonanych stosownie do normy ISO 230/2:1988 (1) lub jej odpowiednika krajowego pod warunkiem dostarczenia ich organom krajowym i zaakceptowania ich przez nie. Określenie poziomu ‘gwarantowanej dokładności pozycjonowania’:

- a. wybrać pięć egzemplarzy modelu maszyny, który ma być oceniany;*
 - b. zmierzyć liniowe dokładności osi zgodnie z ISO 230/2 (1988 (1));*
 - c. określić wartości dokładności (A) dla każdej osi każdej maszyny. Metodę obliczania wartości dokładności opisano w normie ISO 230/2:1988 (1) 1;*
 - d. określić średnią wartość dokładności dla każdej osi. Średnia wartość staje się gwarantowaną ‘dokładnością pozycjonowania’ dla każdej osi modelu ($\hat{A}_x, \hat{A}_y, \dots$);*
 - e. ponieważ pozycja 2B201 odnosi się do każdej osi liniowej, istnieje tyle wartości gwarantowanej ‘dokładności pozycjonowania’, ile jest osi liniowych;*
 - f. jeśli dowolna oś obrabiarki nie objętej kontrolą przez pozycje 2B201.a., 2B201.b. lub 2B201.c. ma gwarantowaną ‘dokładność pozycjonowania’ wynoszącą 6 μm lub lepiej (mniej) w przypadku szlifierek oraz 8 μm lub lepiej (mniej) w przypadku frezarek i tokarek, zawsze zgodnie z normą ISO 230/2:1988 (1), od wytwórcy należy wymagać ponownego potwierdzenia poziomu dokładności co osiemnaście miesięcy.*
- a. frezarki posiadające którąkolwiek z wymienionych poniżej cech:*
 - 1. dokładność pozycjonowania, z uwzględnieniem „wszystkich dostępnych kompensacji”, równa 6 μm lub mniej (lepsza), zgodnie z ISO 230/2 (1988) (1) lub równoważną normą krajową, wzdłuż dowolnej osi liniowej;*
 - 2. dwie lub więcej konturowych osi obrotu; lub*

(1) Producenci wyliczający dokładność pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) lub (2006) powinni konsultować się z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę.

2B201 a. (ciąg dalszy)

3. pięć lub więcej osi, które można jednocześnie koordynować w celu „sterowania kształtowego”;

Uwaga: Pozycja 2B201.a nie obejmuje kontrolą frezarek posiadających następujące cechy:

- a. robocza długość osi x większa niż 2 m; oraz
 - b. ogólna dokładność pozycjonowania wzdłuż osi x większa (gorsza) niż 30 μm ;
- b. szlifiereki posiadające którąkolwiek z wymienionych poniżej cech:
1. dokładność pozycjonowania, z uwzględnieniem „wszystkich dostępnych kompensacji”, równa 4 μm lub mniej (lepsza), zgodnie z ISO 230/2 (1988) ⁽¹⁾ lub równoważną normą krajową, wzdłuż dowolnej osi liniowej;
 2. dwie lub więcej konturowych osi obrotu; lub
 3. pięć lub więcej osi, które można jednocześnie koordynować w celu „sterowania kształtowego”;

Uwaga: Pozycja 2B201.b nie obejmuje kontrolą następujących szlifierek:

- a. szlifierek do zewnętrznego, wewnętrznego i zewnętrzno-wewnętrznego szlifowania na okrągło, posiadających wszystkie niżej wymienione cechy:
 1. ograniczenie do maksymalnych wymiarów przedmiotu obrabianego do 150 mm średnicy zewnętrznej lub długości; oraz
 2. osie ograniczone do x , z i c ;
 - b. szlifierek współrzędnościowych nieposiadających osi z lub osi w przy ogólnej ‘dokładności pozycjonowania’ mniejszej (lepszej) niż 4 μm zgodnie z ISO 230/2:1988 lub równoważną normą krajową.
- c. tokarek, które mają ‘dokładności pozycjonowania’ z uwzględnieniem „wszystkich dostępnych kompensacji” lepsze (mniejsze) niż 6 μm , zgodnie z normą ISO 230/2:1988, wzdłuż dowolnej osi liniowej (ogólna dokładność pozycjonowania), dla maszyn zdolnych do obrabiania średnic powyżej 35 mm;

Uwaga: Pozycja 2B201.c. nie obejmuje kontrolą tokarek (Swissturn), ograniczonych do obrabiania tylko prętów podawanych, jeśli maksymalna średnica pręta jest równa lub mniejsza niż 42 mm i w których nie istnieje możliwość mocowania uchwytami. Maszyny mogą mieć możliwość wiercenia lub frezowania części o średnicy mniejszej niż 42 mm.

Uwaga 1: Pozycja 2B201 nie obejmuje kontrolą obrabiarek do specjalnych zastosowań ograniczonych do wytwarzania dowolnych z następujących części:

- a. kół zębatych;
- b. wałów korbowych lub rozrządowych;
- c. narzędzi lub noży do obrabiarek;

⁽¹⁾ Producenci wyliczający dokładność pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) lub (2006) powinni konsultować się z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę.

2B201 Uwaga 1 (ciąg dalszy)

d. ślimaków do wylączarek;

Uwaga 2: Obrabiarki mogące wykonywać co najmniej dwie z trzech funkcji obejmujących: toczenie, frezowanie lub szlifowanie (np. tokarka z możliwością frezowania), podlegają ocenie na podstawie kryteriów dotyczących każdej stosownej pozycji 2B201.a., b. lub c.”

Strona 133, pozycja 3A001.a.5.b.2:

zamiast: „rozdzielczość 12 bitów lub większa przy ‘skorygowanej prędkości aktualizacji’ równej lub większej niż 1 250 MSPS i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:”;

powinno być: „rozdzielczość 12 bitów lub większa przy ‘skorygowanej prędkości aktualizacji’ większej niż 1 250 MSPS i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:”.

Strona 185, pozycje 6A001–6A001.a.1 otrzymują brzmienie:

„6A001 Następujące systemy, urządzenia i części akustyczne:

a. następujące okrętowe systemy akustyczne, urządzenia lub specjalnie do nich zaprojektowane części składowe:

1. następujące systemy aktywne (nadajniki lub nadajniki-odbiorniki), urządzenia i specjalnie do nich zaprojektowane części składowe:

Uwaga: Pozycja 6A001.a.1 nie obejmuje kontrolą następujących urządzeń:

a. sond do pomiaru głębokości pracujących w pionie pod aparaturą, niemających możliwości przeszukiwania w zakresie szerszym niż $\pm 20^\circ$, których działanie jest ograniczone do pomiaru głębokości wody, odległości do zanurzonych lub zagrzebanych obiektów lub do wykrywania ławic ryb;

b. następujących pław lub staw akustycznych:

1. akustycznych pław lub staw ostrzegawczych;

2. sonarów impulsowych specjalnie zaprojektowanych do przemieszczenia się lub powrotu do położenia podwodnego.

a. następujące urządzenia do akustycznego badania dna morskiego:

1. urządzenia dla statków nawodnych zaprojektowane do sporządzania map topograficznych dna morskiego i spełniające wszystkie poniższe kryteria:

a. przeznaczenie do dokonywania pomiarów pod kątem większym niż 20° w stosunku do pionu;

b. przeznaczenie do pomiarów topografii dna morskiego położonego na głębokościach większych niż 600 m;

c. ‘rozdzielczość sondowania’ mniejsza niż 2; oraz

d. ‘zwiększenie’ dokładności określania głębokości poprzez kompensację w odniesieniu do wszystkich poniższych:

1. ruch czujnika akustycznego;

6A001 a. 1. a. 1. d. (ciąg dalszy)

2. rozchodzenie się fali w wodzie w kierunku od czujnika do dna morskiego i z powrotem;
3. prędkość dźwięku przy czujniku;

Uwagi techniczne

1. 'Rozdzielczość sondowania' oznacza szerokość pola omiatania (w stopniach) podzieloną przez liczbę sondowań na jedno omiecenie.
 2. 'Zwiększenie' obejmuje zdolność kompensowania z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
2. podwodne urządzenia zaprojektowane do sporządzania map topograficznych dna morskiego i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

Uwaga techniczna:

Wartość ciśnienia czujnika akustycznego określa wartość głębokości urządzeń wymienionych w pozycji 6A001.a.1.a.2.

a. spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:

1. zaprojektowany lub zmodyfikowany do pracy na głębokościach przekraczających 300 m; oraz
2. 'wskaźnik sondowania' większy niż 3 800 m/s; lub

Uwaga techniczna:

'Wskaźnik sondowania' jest iloczynem maksymalnej prędkości (w m/s), z jaką może pracować czujnik i maksymalnej liczby sondowań na jedno omiecenie, przy założeniu 100 % pokrycia. W przypadku systemów, które prowadzą sondowanie w dwóch kierunkach (sonary 3D) należy zastosować maksymalny wskaźnik sondowania, bez względu na jego kierunek.

b. urządzenia zaprojektowane do sporządzania map topograficznych, niewymienione w pozycji 6A001.a.1.a.2.a., spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1. zaprojektowany lub zmodyfikowany do pracy na głębokościach przekraczających 100 m;
2. przeznaczenie do dokonywania pomiarów pod kątem większym niż 20° w stosunku do pionu;
3. spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. częstotliwość robocza poniżej 350 kHz; lub
 - b. zaprojektowane do dokonywania pomiarów topografii dna morskiego w zasięgu przekraczającym 200 m przy pomocy czujnika akustycznego; oraz
4. 'zwiększenie' dokładności określania głębokości poprzez kompensację w odniesieniu do wszystkich poniższych:
 - a. ruch czujnika akustycznego;

6A001 a. 1. a. 2. b. 4. (ciąg dalszy)

- b. rozchodzenie się fali w wodzie w kierunku od czujnika do dna morskiego i z powrotem;
oraz
 - c. prędkość dźwięku przy czujniku;
3. boczny sonar skanujący (SSS) lub sonar z syntezą apertury (SAS) zaprojektowany do obrazowania dna morskiego i spełniające wszystkie poniższe kryteria:
- a. zaprojektowany lub zmodyfikowany do pracy na głębokościach przekraczających 500 m;
 - b. 'wskaźnik pokrycia obszaru' większy niż $570 \text{ m}^2/\text{s}$ podczas pracy przy maksymalnym zasięgu, z jakim może pracować, z 'rozdzielczością wzdłużną' mniejszą niż 15 cm; oraz
 - c. 'rozdzielczość poprzeczna' mniejsza niż 15 cm;

Uwagi techniczne

1. 'Wskaźnik pokrycia powierzchni' (w m^2/s) stanowi dwukrotność iloczynu zakresu sonaru (w m) oraz maksymalnej prędkości (w m/s), z jaką może pracować czujnik przy tym zakresie.
 2. 'Rozdzielczość wzdłużna' (w cm) – wyłącznie w odniesieniu do SSS, jest iloczynem azymutowej (poziomej) szerokości wiązki (w stopniach), zakresu sonaru (w m) i liczby 0,873.
 3. 'Rozdzielczość poprzeczna' (w cm) jest ilorazem liczby 75 i szerokości pasma sygnału (w kHz).
- b. Systemy lub matryce nadawcze lub odbiorcze, zaprojektowane do wykrywania lub lokalizacji obiektów, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. częstotliwość nośna poniżej 10 kHz;
 2. poziom ciśnienia akustycznego powyżej 224 dB (poziom odniesienia $1 \mu\text{Pa}$ na 1 m) w odniesieniu do urządzeń z częstotliwością roboczą w paśmie od 10 kHz do 24 kHz włącznie;
 3. poziom ciśnienia akustycznego powyżej 235 dB (poziom odniesienia $1 \mu\text{Pa}$ na 1 m) w odniesieniu do urządzeń z częstotliwością roboczą w paśmie od 24 kHz do 30 kHz;
 4. kształtujące wiązki o kącie rozproszenia poniżej 1° względem dowolnej osi i posiadające częstotliwość roboczą poniżej 100 kHz;
 5. umożliwiające jednoznaczny pomiar odległości do obiektów w zakresie powyżej 5 120 m; lub
 6. skonstruowane w ten sposób, że w normalnych warunkach pracy są wytrzymałe na ciśnienia na głębokości większej niż 1 000 m i są zaopatrzone w przetworniki spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
 - a. z dynamiczną kompensacją ciśnienia; lub
 - b. w których elementem przetwarzającym nie jest cyrkonian/tytanium ołowiu;

6A001 a. 1. b. 6. (ciąg dalszy)

- c. reflektory akustyczne, łącznie z przetwornikami, wyposażone w elementy piezoelektryczne, magnetostrykcyjne, elektrostrykcyjne, elektrodynamiczne lub hydrauliczne, działające indywidualnie lub w odpowiedniej kombinacji zespolonej i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

Uwaga 1: Poziom kontroli reflektorów akustycznych, łącznie z przetwornikami, specjalnie zaprojektowanych do innych urządzeń niewymienionych w pozycji 6A001, wynika z poziomu kontroli tych innych urządzeń.

Uwaga 2: Pozycja 6A001.a.1.c nie obejmuje kontrolą elektronicznych źródeł kierujących dźwięk tylko w pionie ani źródeł mechanicznych (np. pistolety powietrzne lub parowe) lub chemicznych (np. materiały wybuchowe).

Uwaga 3: Elementy piezoelektryczne wymienione w pozycji 6A001.a.1.c. obejmują elementy wykonane z pojedynczych kryształów piezoelektrycznych niobianu ołowiu i magnezu/tytanianu ołowiu ($\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{-PbTiO}_3$, lub PMN-PT) wytworzonych z roztworu stałego lub pojedynczych kryształów piezoelektrycznych niobianu ołowiu i indu/niobianu ołowiu i magnezu/tytanianu ołowiu ($\text{Pb}(\text{In}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3\text{-Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{-PbTiO}_3$, lub PIN-PMN-PT) wytworzonych z roztworu stałego.

1. działające w zakresie częstotliwości poniżej 10 kHz i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

- a. nie są zaprojektowane do ciągłej pracy przez 100 % cyklu roboczego i mają promieniowany 'poziom mocy źródła w polu swobodnym (SL_{RMS})' przekraczający $(10\log(f) + 169,77)$ dB (odniesienie 1 μPa przy 1 m), gdzie f oznacza częstotliwość w hercach maksymalnej odpowiedzi na pobudzenie napięciowe (TVR) poniżej 10kHz; lub
- b. są zaprojektowane do ciągłej pracy przez 100 % cyklu roboczego i mają stale promieniowany 'poziom mocy źródła w polu swobodnym (SL_{RMS})' przez 100 % cyklu roboczego przekraczający $(10\log(f) + 159,77)$ dB (odniesienie 1 μPa przy 1 m), gdzie f oznacza częstotliwość w hercach maksymalnej odpowiedzi na pobudzenie napięciowe (TVR) poniżej 10kHz; lub

Uwaga techniczna:

'Poziom mocy źródła w polu swobodnym (SL_{RMS})' jest określany wzdłuż osi maksymalnej odpowiedzi i w części pola w dużej odległości od źródła promieniowania projektora dźwiękowego. Może on zostać obliczony na podstawie odpowiedzi na pobudzenie napięciowe przy zastosowaniu następującego równania: $SL_{\text{RMS}} = (\text{TVR} + 20\log V_{\text{RMS}})$ dB (ref 1 μPa przy 1 m), gdzie SL_{RMS} oznacza poziom mocy źródła, TVR oznacza odpowiedź na pobudzenie napięciowe, a V_{RMS} oznacza napięcie sterowania projektora.

2. nieużywane;

3. tłumienie pasma bocznego częstotliwości powyżej 22 dB;

- d. systemy akustyczne i urządzenia do określania położenia statków nawodnych lub pojazdów podwodnych spełniające wszystkie poniższe kryteria oraz elementy zaprojektowane specjalnie do nich:

1. zasięg wykrywania powyżej 1 000 m; oraz
2. wyznaczanie położenia z dokładnością poniżej 10 m (wartość średnia kwadratowa) w przypadku pomiaru w zasięgu do 1 000 m;

Uwaga: Pozycja 6A001.a.1.d obejmuje:

6A001 a. 1. d. 2. d. Uwaga (ciąg dalszy)

- a. urządzenia, w których zastosowano koherentne „przetwarzanie sygnałów” pomiędzy dwiema lub większą liczbą boi kierunkowych a hydrofonem na statku nawodnym lub w pojeździe podwodnym;
 - b. urządzenia mające możliwość automatycznego korygowania błędów prędkości rozchodzenia się dźwięku w celu obliczenia położenia obiektu.
- e. aktywne pojedyncze sonary, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu wykrywania, ustalania położenia i automatycznej klasyfikacji pływaków lub nurków, spełniające wszystkie poniższe kryteria oraz specjalnie do nich zaprojektowane nadawcze i odbiorcze akustyczne zestawy matrycowe:
1. zasięg wykrywania powyżej 530 m;
 2. wyznaczanie położenia z dokładnością poniżej 15 m (wartość średnia kwadratowa) w przypadku pomiaru w zasięgu do 530 m; oraz
 3. szerokość pasma przekazywanego impulsu powyżej 3 kHz;

N.B.: Systemy wykrywania nurków specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowań wojskowych – zob. wykaz uzbrojenia.

Uwaga: W przypadku pozycji 6A001.a.1.e, jeśli określono wiele zasięgów wykrywania w zależności od środowiska, zastosowanie ma największy zasięg.”

Strona 193, pozycja 6A002.a.2.a.2.a:

zamiast: „matryce detektorowe płaszczyzny ogniskowej” „klasy kosmicznej” mające więcej niż 2 048 elementów na zespół i reakcję szczytową w paśmie fal o długości powyżej 300 nm, ale nieprzekraczającej 900 nm;”;

powinno być: „elektrody mikrokanalikowej z otworkami w odstępach (odległość pomiędzy środkami otworków) 12 µm lub mniejszych; lub”.

Strona 256, pozycja 9A004 otrzymuje brzmienie:

„9A004 Następujące kosmiczne pojazdy nośne, „statek kosmiczny”, „moduły ładunkowe statku kosmicznego”, „ładunki użyteczne statku kosmicznego”, systemy pokładowe lub wyposażenie „statku kosmicznego”, a także wyposażenie naziemne:

N.B.: ZOB. TAKŻE POZYCJA 9A104.

- a. kosmiczne pojazdy nośne;
- b. „statek kosmiczny”;
- c. „moduły ładunkowe statku kosmicznego”;

9A004 (ciąg dalszy)

- d. „ładunki użyteczne statku kosmicznego” obejmujące elementy określone w pozycjach 3A001.b.1.a.4., 3A002.g., 5A001.a.1., 5A001.b.3., 5A002.a.5., 5A002.a.9., 6A002.a.1., 6A002.a.2., 6A002.b., 6A002.d., 6A003.b., 6A004.c., 6A004.e., 6A008.d., 6A008.e., 6A008.k., 6A008.l. lub 9A010.c.;
- e. systemy pokładowe lub wyposażenie specjalnie zaprojektowane do „statku kosmicznego” i posiadające którąkolwiek z następujących funkcji:
1. ‘obsługa danych sterowania i telemetrii’;
Uwaga: Do celów pozycji 9A004.e.1. ‘obsługa danych sterowania i telemetrii’ obejmuje zarządzanie, przechowywanie i przetwarzanie danych modułu ładunkowego.
 2. ‘obsługa danych ładunku użytecznego’; lub
Uwaga: Do celów pozycji 9A004.e.2. ‘obsługa danych ładunku użytecznego’ obejmuje zarządzanie, przechowywanie i przetwarzanie danych ładunku użytecznego.
 3. ‘sterowanie położeniem i kierunkiem orbitowania’;
Uwaga: Do celów pozycji 9A004.e.3. ‘sterowanie położeniem i kierunkiem orbitowania’ obejmuje wykrywanie i wzbudzenie w celu określenia położenia i kierunku „statku kosmicznego” oraz sterowania nimi.
- N.B.:* W przypadku urządzeń zaprojektowanych specjalnie do zastosowań wojskowych zob. wykaz uzbrojenia.
- f. następujące wyposażenie naziemne, specjalnie zaprojektowane do „statku kosmicznego”:
1. wyposażenie telemetryczne i do zdalnego sterowania;
 2. symulatory.”

Strona 269, pozycja 9C110:

zamiast: „„wytrzymałość właściwą na rozciąganie” większą niż $7,62 \times 10^4$ ⁽¹⁾ (...)”,

powinno być: „„wytrzymałość właściwą na rozciąganie” większą niż $7,62 \times 10$ ⁽¹⁾ (...)”.

⁽¹⁾ Producenci wyliczający dokładność pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) lub (2006) powinni konsultować się z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę.